

XRR 解析レポート

プロジェクト

パス: 未保存
DBでの共有レベル: 共有

解析条件

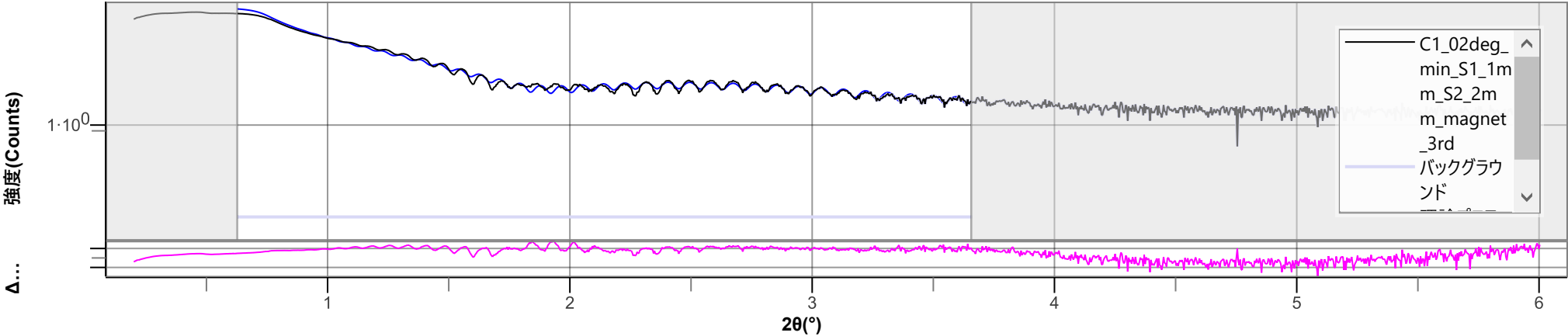
波長(nm): 0.15403
点数: 1451
2θ(°):開始 = 0.200, 終了 = 6.000
ステップ = 0.004
オフセット = 0.000e+000

フィッティング手法: Nelder-Mead
データ間隔:1点ごとにフィッティング
残差タイプ: |Δ(LogI)|
最大反復数: 500
許容誤差: 1.00e-015

装置関数: 擬Voigt関数
ローレンツ関数の比率: 0.00
ローレンツ幅: 1.00e-002
ガウス幅: 1.00e-002

結果

プロファイルプロット



	使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)<th>	密度(g/cm³)<d>	粗さ(nm)<rg>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L4	Fe2O3	1.302 Const ±0.01 精密化	2.21530 Const ±0.019 精密化	0.100 Con... ±0.02最小← 精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L3	Fe2O3	2.174 Const ±1 精密化	4.95000 Const ±0.02 ←最大 精密化	0.000 Con... ±0.04最小← 精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L2	Fe	91.655 Const ±0.07 精密化	7.24775 Const ±0.03 精密化	0.000 Con... ±0.05最小← 精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L1	Fe	2.726 Const ±0.07 精密化	3.93700 Const ±0.05 最小← 精密化	0.788 Con... ±0.012 精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	基板	Si	∞	2.32924 Const	0.500 Con...	